



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 998, 2013

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Pemeriksa Paten. Jabatan Fungsional. Angka
Kredit. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 47/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan di bidang pelayanan pemeriksaan paten, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten.**
- 2. Pemeriksa Paten adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.**
- 4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Paten dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.**
- 5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Paten.**
- 6. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang paten.**
- 7. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Paten yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Paten.**

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan permohonan paten.
- (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Paten yaitu melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substantif permohonan paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan paten.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pembinaan, antara lain:

- a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
- b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;

- c. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
- d. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Paten;
- e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Paten;
- f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Paten;
- g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
- h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang paten;
- i. mengusulkan tunjangan dan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
- j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
- l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Paten; dan
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

BAB IV

JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten merupakan jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - (1) Pemeriksa Paten Pertama;
 - (2) Pemeriksa Paten Muda;
 - (3) Pemeriksa Paten Madya; dan
 - (4) Pemeriksa Paten Utama.
- (3) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

- a. **Pemeriksa Paten Pertama:**
 1. **Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan**
 2. **Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.**
 - b. **Pemeriksa Paten Muda:**
 1. **Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan**
 2. **Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.**
 - c. **Pemeriksa Paten Madya:**
 1. **Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;**
 2. **Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan**
 3. **Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.**
 - d. **Pemeriksa Paten Utama:**
 1. **Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan**
 2. **Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.**
- (4) **Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.**
- (5) **Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).**

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. **Pendidikan, meliputi:**
 1. **Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;**
 2. **Diklat fungsional/teknis di bidang paten serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan**
 3. **Diklat Prajabatan.**

- b. **Pengelolaan dokumen permohonan paten, meliputi:**
 - 1. **Pencatatan;**
 - 2. **Pemilahan dokumen permohonan sesuai kategori dan bidang substansi;**
 - 3. **Pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan**
 - 4. **Penataan dokumen.**
- c. **Pemeriksaan substantif permohonan paten, meliputi:**
 - 1. **Pemeriksaan kelayakan invensi;**
 - 2. **Penganalisisan kejelasan invensi (*clary of invention*);**
 - 3. **Pemeriksaan abstrak;**
 - 4. **Pemeriksaan gambar;**
 - 5. **Penganalisisan klaim;**
 - 6. **Pengklasifikasian;**
 - 7. **Pengklasifikasian ulang;**
 - 8. **Penelusuran;**
 - 9. **Penelusuran tambahan;**
 - 10. **Penentuan kebaruan invensi;**
 - 11. **Penentuan langkah inventif;**
 - 12. **Penentuan keterterapan dalam industri;**
 - 13. **Pelaksanaan komunikasi;**
 - 14. **Pelaksanaan hearing;**
 - 15. **Pelaksanaan Mediasi;**
 - 16. **Pembuatan keputusan;**
 - 17. **Pemeriksaan dampak pemberian paten terhadap paten yang masih berlaku;**
 - 18. **Pembuatan surat penarikan; dan**
 - 19. **Supervisi.**
- d. **Penganalisisan hukum terkait dengan paten, meliputi:**
 - 1. **Penerapan preseden hukum;**
 - 2. **Penentuan kecukupan bukti penggunaan;**
 - 3. **Penentuan paten ganda;**
 - 4. **Pengevaluasian keterangan ahli tertulis atas suatu referensi yang sama;**

5. Pemberian keputusan atas permohonan paten yang telah lebih dahulu digunakan atau diumumkan;
 6. Pemberian argumen pada Komisi Banding;
 7. Menjadi saksi ahli;
 8. Pelaksanaan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten; dan
 9. Pelaksanaan tugas internalisasi paten.
- e. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang paten;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang paten; dan
 3. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis pemeriksaan paten.
- f. Penunjang tugas Pemeriksa Paten, meliputi:
1. Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang paten;
 2. Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang paten;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 4. Keanggotaan Tim Penilai;
 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. **Pemeriksa Paten Pertama, meliputi:**
1. mencatat dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri yang diterima;
 2. memilah dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan kategori;

3. memilah dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan bidang substansi;
4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
6. memberi label permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
7. menyusun dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan paten W dengan 3 (tiga) dokumen permohonan substantif klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri
8. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
9. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
10. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana normal;
11. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
12. menentukan invensi yang diajukan memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
13. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan Paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten Sederhana Normal;
14. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan Paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
15. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;

16. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
17. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
18. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
19. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
20. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
21. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
22. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
23. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
24. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
25. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
26. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
27. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
28. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
29. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
30. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
31. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
32. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
33. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;

34. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
35. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
36. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
37. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
38. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
39. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
40. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*). dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
41. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*). dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
42. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
43. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
44. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
45. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
46. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;

47. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
48. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
49. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
50. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
51. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
52. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
53. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
54. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
55. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
56. menentukan langkah-langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
57. menentukan langkah-langkah inventif dengan Mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
58. menentukan langkah-langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
59. menentukan langkah-langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;

60. menentukan langkah-langkah inventif dengan Menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
61. menentukan langkah-langkah inventif dengan Menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
62. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
63. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
64. membuat surat hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
65. membuat surat hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
66. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
67. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
68. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
69. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
70. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
71. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
72. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
73. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
74. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
75. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;

76. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
 77. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
 78. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
 79. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
 80. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten Sederhana normal;
 81. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
 82. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;
 83. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
 84. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
 85. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
 86. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan
 87. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.
- b. Pemeriksa Paten Muda, meliputi:
1. mencatat dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri yang diterima;
 2. memilah dokumen permohonan permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan kategori;

3. memilah dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan bidang substansi;
4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
6. memberi label permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
7. menyusun dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan urutan dan pemohon;
8. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
9. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
10. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
11. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;

12. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
13. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
14. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
15. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
16. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
17. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
18. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
19. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
20. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
21. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
22. menganalisis konsistensi uraian dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
23. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
24. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
25. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;

26. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
27. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
28. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
29. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
30. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
31. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
32. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
33. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
34. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
35. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
36. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
37. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
38. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
39. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
40. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
41. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
42. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

43. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
44. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
45. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
46. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
47. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
48. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
49. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
50. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
51. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
52. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
53. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
54. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

55. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
56. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
57. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*). dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
58. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*). dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
59. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
60. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
61. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
62. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
63. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
64. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
65. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;

66. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
67. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
68. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
69. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
70. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
71. melakukan penelusuran tambahan dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
72. melakukan penelusuran tambahan dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
73. melakukan penelusuran tambahan dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusurandalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
74. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten gandadalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
75. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
76. melakukan penelusuran tambahan dengan Melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten

ganda dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;

77. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
78. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
79. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
80. menentukan langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
81. menentukan langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
82. menentukan langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
83. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
84. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
85. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
86. menentukan langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
87. menentukan langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

88. menentukan langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
89. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
90. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
91. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
92. menentukan langkah inventif dengan menganalisis efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
93. menentukan langkah inventif dengan menganalisis efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
94. menentukan langkah inventif dengan menganalisis efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
95. menentukan langkah inventif dengan menentukan ketidakterdugaan (*non-obvious*) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
96. menentukan langkah inventif dengan menentukan ketidakterdugaan (*non-obvious*) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
97. menentukan langkah inventif dengan menentukan ketidakterdugaan (*non-obvious*) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;

98. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
99. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
100. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
101. membuat surat hasil pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
102. membuat surat hasil pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
103. membuat surat hasil pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
104. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
105. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
106. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
107. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
108. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
109. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
110. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
111. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
112. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
113. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;

114. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
115. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
116. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
117. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
118. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
119. memberikan keputusan (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
120. memberikan keputusan (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
121. memberikan keputusan (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
122. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri yang belum diproses;
123. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih yang belum diproses;
124. membuat surat penarikan kembali Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri yang belum diproses;
125. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri yang sedang dalam proses pemeriksaan;
126. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih yang sedang dalam proses pemeriksaan;
127. membuat surat penarikan kembali Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri yang sedang dalam proses pemeriksaan;
128. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan tahap awal Pemeriksa Paten Pertama;
129. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan tahap lanjutan Pemeriksa Paten Pertama;

- 130.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan tahap akhir Pemeriksa Paten Pertama;
- 131.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan penarikan kembali Pemeriksa Paten Pertama;
- 132.melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;
- 133.melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
- 134.melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
- 135.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
- 136.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan
- 137.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.

c. **Pemeriksa Paten Madya, meliputi:**

1. mencatat dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif Paten Sederhana Lengkap yang diterima;
2. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif Paten Sederhana Lengkap sesuai dengan kategori ;
3. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap sesuai dengan bidang substansi;
4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap;
5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim

- mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap;
6. memberi label dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap;
 7. menyusun dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Sederhana Lengkap sesuai dengan urutan dan pemohon;
 8. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
 9. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
 10. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
 11. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
 12. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
 13. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
 14. menentukan invensi yang diajukan memenuhi Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
 15. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
 16. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
 17. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;

18. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
19. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
20. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
21. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
22. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
23. menganalisis konsistensi uraian Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
24. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
25. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
26. menganalisis konsistensi penggunaan istilah Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
27. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
28. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
29. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
30. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
31. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
32. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
33. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
34. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
35. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
36. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
37. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

38. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
39. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
40. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
41. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
42. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
43. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
44. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
45. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
46. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
47. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
48. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
49. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
50. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
51. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
52. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
53. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;

54. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
55. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
56. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
57. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
58. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
59. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
60. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
61. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
62. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
63. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
64. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
65. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
66. menentukan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*), dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
67. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
68. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili paten pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
69. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili paten pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

70. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
71. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
72. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
73. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
74. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
75. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
76. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
77. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
78. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
79. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
80. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
81. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
82. mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
83. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
84. memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

85. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
86. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
87. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
88. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
89. menentukan ketidak-terdugaan (*non-obvious*) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
90. menentukan ketidak-terdugaan (*non-obvious*) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
91. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
92. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
93. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
94. membuat surat hasil pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
95. membuat surat hasil pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
96. membuat surat hasil pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
97. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
98. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
99. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
100. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;

- 101.menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 102.menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 103.membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 104.membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 105.membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 106.menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 107.menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 108.menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 109.melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 110.melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 111.melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 112.melakukan Mediasi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 113.membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 114.membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 115.membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 116.memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain untuk pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 117.membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 118.membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 119.membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;

- 120.membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 121.membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 122.membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
- 123.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda pada tahap awal;
- 124.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda pada tahap lanjutan;
- 125.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda pada tahap akhir;
- 126.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda untuk penarikan kembali;
- 127.melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;
- 128.melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
- 129.melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
- 130.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penasehat (advisor) di lembaga-lembaga penelitian;
- 131.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai koordinator pemeriksa antar kantor paten;
- 132.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai Koordinator pemeriksa untuk mediasi paten;
- 133.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai ketua kelompok Pemeriksa Paten;
- 134.
- 135.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim sistem inovasi nasional;
- 136.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim ekonomi kreatif;
- 137.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota dewan riset nasional;
- 138.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim koordinasi perizinan peneliti asing;
- 139.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji calon pemeriksa paten;
- 140.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa paten;

141. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim penerapan dan pengkajian teknologi;
142. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai juri lomba inovasi nasional;
143. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai tim pelaksanaan paten;
144. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
145. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan
146. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.

d. **Pemeriksa Paten Utama, meliputi:**

1. mencatat dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih yang diterima;
2. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih sesuai dengan kategori;
3. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih sesuai dengan bidang substansi;
4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
6. memberi label dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

7. menyusun dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri sesuai dengan urutan dan pemohon;
8. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
9. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
10. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
11. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
12. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
13. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
14. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
15. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
16. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
17. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
18. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
19. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

20. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
21. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
22. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
23. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
24. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
25. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
26. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
27. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
28. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
29. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
30. menganalisis konsistensi simbol satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
31. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
32. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
33. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
34. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
35. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
36. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
37. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
38. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
39. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
40. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

41. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
42. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
43. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
44. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
45. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
46. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
47. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
48. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
49. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
50. menentukan persoalan pokok (subject matter) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
51. menentukan persoalan pokok (subject matter) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
52. menentukan persoalan pokok (subject matter) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
53. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
54. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;

55. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
56. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
57. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
58. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
59. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
60. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
61. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
62. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
63. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
64. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
65. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
66. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
67. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
68. menentukan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

69. menentukan dokumen pembanding terdekat (closest prior art), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
70. menentukan dokumen pembanding terdekat (closest prior art), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
71. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
72. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
73. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
74. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (closest prior art) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
75. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (closest prior art) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
76. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (closest prior art) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
77. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
78. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
79. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, paten dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
80. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
81. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
82. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
83. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

84. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
85. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
86. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
87. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
88. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
89. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
90. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
91. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
92. menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
93. menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
94. menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
95. menerapkan teori murni terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
96. menerapkan teori murni terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
97. menerapkan teori murni terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
98. mengevaluasi lingkup klaim pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

99. mengevaluasi lingkup klaim pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
100. mengevaluasi lingkup klaim pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
101. mengevaluasi perubahan/amandemen klaim-klaim terhadap permohonan asli pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
102. mengevaluasi perubahan/amandemen klaim-klaim terhadap permohonan asli pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
103. mengevaluasi perubahan/amandemen klaim-klaim terhadap permohonan asli pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
104. menentukan jika pemohon harus diminta untuk membatasi klaim-klaim terhadap invensi tunggal, bukan pluralitas klaim invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
105. menentukan jika pemohon harus diminta untuk membatasi klaim-klaim terhadap invensi tunggal, bukan pluralitas klaim invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
106. menentukan jika pemohon harus diminta untuk membatasi klaim-klaim terhadap invensi tunggal, bukan pluralitas klaim invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
107. mengenali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
108. mengenali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
109. mengenali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
110. memutuskan keadaan khusus dimana pemohon mencoba untuk membuat perubahan besar dalam permohonan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
111. memutuskan keadaan khusus dimana pemohon mencoba untuk membuat perubahan besar dalam permohonan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
112. memutuskan keadaan khusus dimana pemohon mencoba untuk membuat perubahan besar dalam permohonan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

113. menentukan keefektifan dan/atau kegunaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
114. menentukan keefektifan dan/atau kegunaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
115. menentukan keefektifan dan/atau kegunaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
116. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
117. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
118. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
119. membuat surat hasil pemeriksaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
120. membuat surat hasil pemeriksaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
121. membuat surat hasil pemeriksaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
122. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
123. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
124. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
125. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
126. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
127. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
128. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
129. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
130. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
131. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

- 132.menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 133.menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 134.melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
- 135.melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 136.melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 137.melakukan Mediasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
- 138.melakukan Mediasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 139.melakukan Mediasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 140.membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
- 141.membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
- 142.membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 143.memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
- 144.memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri
- 145.memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 146.membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
- 147.membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri

- 148.membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 149.membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
- 150.membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri
- 151.membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
- 152.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya tahap awal;
- 153.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya tahap lanjutan;
- 154.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya tahap akhir;
- 155.melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya penarikan kembali;
- 156.melakukan penelitian hukum untuk menentukan the state of law sehubungan dengan masalah hukum yang tidak biasa yang mungkin berkembang dalam proses penuntutan atas permohonan;
- 157.mengevaluasi preseden kasus yang ditemukan dan menentukan penerapannya dengan kasus yang sedang ditangani;
- 158.mengevaluasi bukti kegunaan dan menentukan pemenuhan aturan hukum untuk tujuan pembuktian kegunaan;
- 159.menentukan satu dari beberapa permohonan paten yang sama yang diajukan oleh pemohon;
- 160.menentukan kelengkapan persyaratan keputusan (diberi atau ditolaknya) suatu permohonan paten berdasarkan keterangan-keterangan ahli yang disampaikan oleh pemohon;
- 161.mengevaluasi penjelasan pemohon dengan melakukan dengar pendapat (hearing);
- 162.mengevaluasi penjelasan pemohon dengan melakukan mempertimbangkan permintaan hak khusus;
- 163.mengevaluasi penjelasan pemohon dengan melakukan membuat keputusan mengenai penggunaan invensi tersebut sebelum dimohonkan patennya;
- 164.memperikan argumen pada Komisi Banding;
- 165.menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di DPR;

166. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di Pengadilan;
167. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di Kepolisian;
168. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di KPPU;
169. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di instansi terkait lainnya;
170. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;
171. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
172. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
173. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penasehat (advisor) di lembaga-lembaga penelitian;
174. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai koordinator pemeriksa antar kantor paten;
175. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai Koordinator pemeriksa untuk mediasi paten;
176. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai ketua kelompok Pemeriksa Paten;
177. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim sistem inovasi nasional;
178. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim ekonomi kreatif;
179. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota dewan riset nasional;
180. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim koordinasi perizinan peneliti asing;
181. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji calon pemeriksa paten;
182. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa paten;
183. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim penerapan dan pengkajian teknologi;
184. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai juri lomba inovasi nasional;
185. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai tim pelaksanaan paten;
186. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
187. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan

188.melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.

- (2) **Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**
- (3) **Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Paten diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Paten yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Pemeriksa Paten lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;**
- b. **Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 12

- (1) **Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Paten wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.**
- (2) **SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Paten yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.**

- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengelolaan dokumen permohonan paten;
 - c. Pemeriksaan substantif permohonan paten;
 - d. Penganalisisan hukum terkait dengan paten; dan
 - e. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- (4) Rincian kegiatan Pemeriksa Paten dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Paten, untuk:
 - a. Pemeriksa Paten dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Pemeriksa Paten dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Pemeriksa Paten dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
- b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) **Pemeriksa Paten Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Paten Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.**
- (2) **Pemeriksa Paten Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.**
- (3) **Pemeriksa Paten Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Paten Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.**
- (4) **Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.**
- (5) **Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.**
- (6) **Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Paten Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.**
- (7) **Pemeriksa Paten Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.**

Pasal 16

- (1) **Pemeriksa Paten yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.**
- (2) **Pemeriksa Paten yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.**

Pasal 17

- (1) **Dalam hal Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina Muda, golongan ruang IV/c yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak tersedia formasi jenjang jabatan Pemeriksa Paten Utama maka pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.**
- (2) **Pemeriksa Paten Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.**

Pasal 18

- (3) **Pemeriksa Paten yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Paten, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. **Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;**
 - b. **Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan**
 - c. **Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.**

- (4) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa Paten wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pemeriksa Paten mengusulkan secara hirarki DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit satu kali setiap tahun.
- (3) Pemeriksa Paten yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 20

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

- a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Paten Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Eselon II yang membidangi paten bagi Pemeriksa Paten Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 21

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh:

- (1) Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi Paten yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.

Pasal 22

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi paten, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Paten.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Paten.
- (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Paten, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Paten.
- (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Paten yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Paten; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 23

Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan
- b. Pejabat Eselon II yang membidangi Paten untuk Tim Penilai Direktorat.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu satu masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.

Pasal 25

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Pemeriksa Paten ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa Paten diajukan oleh:

- a. Pejabat Eselon II yang membidangi paten kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk angka kredit Pemeriksa Paten Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Paten Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
- b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual kepada Pejabat Eselon II yang membidangi paten untuk angka kredit Pemeriksa Paten Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 27

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat Pemeriksa Paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Paten yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Pemeriksa Paten wajib memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang kimia, biologi, farmasi, elektro, fisika, mesin, sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan teknik di bidang *International Patent Classification* (IPC);
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang paten; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Pemeriksa Paten setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Paten.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Paten, diberhentikan dari jabatan fungsional Pemeriksa Paten.

Pasal 30

Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten wajib memenuhi syarat:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- b. memiliki pengalaman di bidang paten paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- d. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

BAB X**UJI KOMPETENSI****Pasal 31**

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pemeriksa Paten yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

BAB XI FORMASI

Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dilaksanakan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten didasarkan pada indikator, antara lain:
- a. ruang lingkup pemeriksaan;
 - b. jumlah permohonan pemeriksaan substansi; dan
 - c. tingkat dan kompleksitas jenis pemeriksaan.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Paten Pertama, paling banyak 56 orang;
 - b. Pemeriksa Paten Muda, paling banyak 45 orang;
 - c. Pemeriksa Paten Madya, paling banyak 40 orang; dan
 - d. Pemeriksa Paten Utama, paling banyak 35 orang.

BAB XII PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Pemeriksa Paten Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) **Pemeriksa Paten Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.**
- (3) **Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa Paten dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:**
 - a. **diberhentikan dari jabatan negeri;**
 - b. **ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;**
 - c. **menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau**
 - d. **menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.**

**Bagian Kedua
Pengangkatan kembali**

Pasal 34

- (1) **Pemeriksa Paten yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, apabila telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.**
- (2) **Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.**
- (3) **Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.**
- (4) **Pemeriksa Paten yang telah selesai dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.**
- (5) **Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten setelah selesai menjalani tugas belajar.**
- (6) **Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka**

kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Pemeriksa Paten diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Pemeriksa Paten yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pemeriksa Paten dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Pasal 39

Pemeriksa Paten yang dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 harus memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pemeriksa Paten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 47/KEP/M-PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 47/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 47/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2013**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN